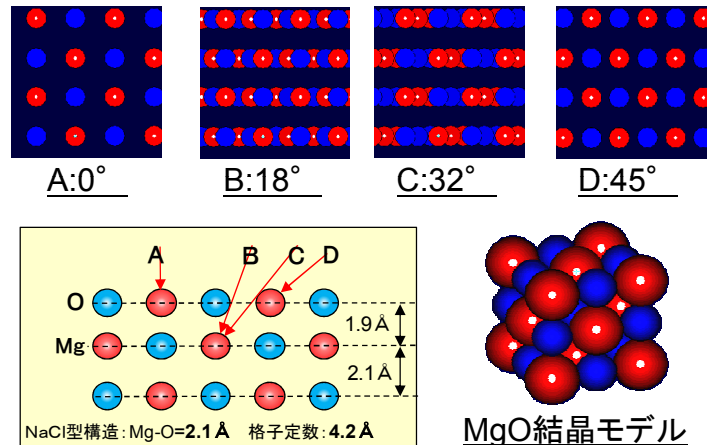
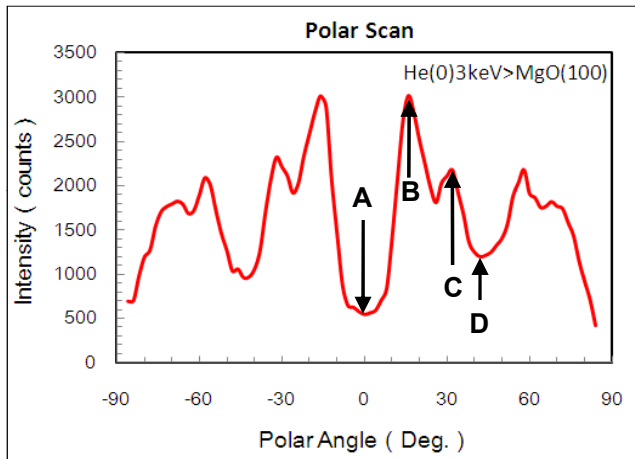
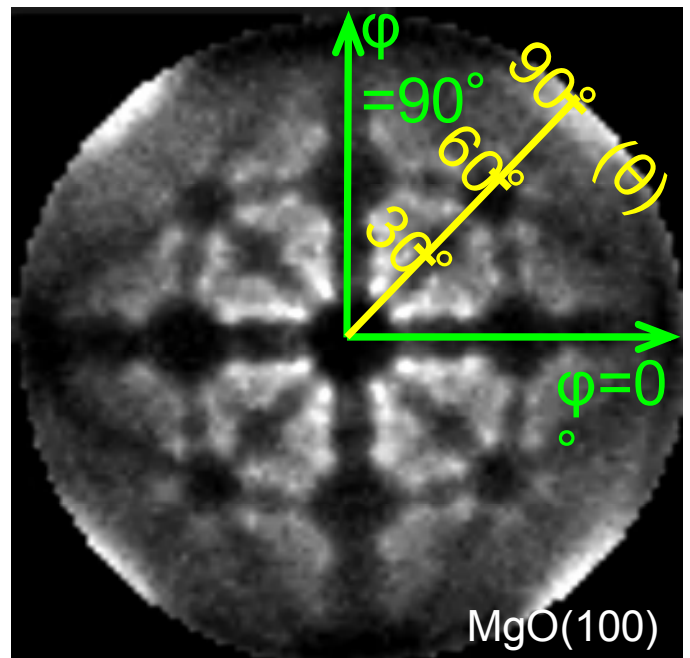
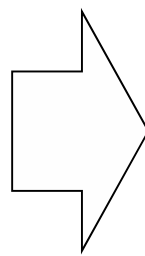
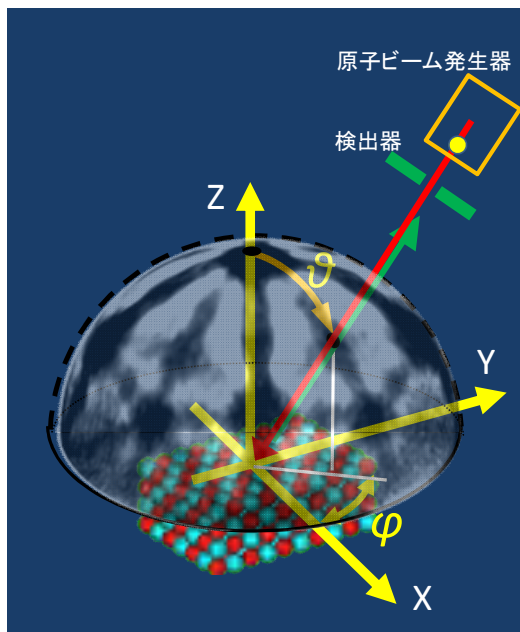


TOFLASによる結晶構造解析法 結晶構造を反映した画像(極点図)の出力

単結晶X線構造解析では結晶の絶対構造評価は行われるが、基板表面の結晶構造評価を目視で即座に確認するのは困難です。ここでは、TOFLASによる表面結晶構造を目視確認可能な極点図を出力するプロセスを紹介します。



ターゲットに結晶構造がある場合、入射角度を振る事でプローブが当たる元素の数が角度毎に増減する。それに伴い、信号強度も増減する。各角度毎の信号強度から結晶構造の解析が可能となる。



結晶を全方位スキャンし、角度毎での散乱強度(信号強度)を濃淡で表す事で上図のような極点図が得られる。極点図を得る事で視覚的に結晶構造の判別が可能となる。

株式会社パスカル

本社 〒545-0011 大阪市阿倍野区昭和町1丁目16番4号
 関東営業所 〒352-0001 埼玉県新座市東北2丁目34番14号
 茨城事業所 〒311-0111 茨城県那珂市後台2288番地10
 札幌出張所 〒004-0865 札幌市清田区北野5条3丁目12番8号
 <URL> <http://www.pascal-co-ltd.co.jp>

TEL: 06-6626-1321 FAX: 06-6626-1323
 TEL: 048-476-8741 FAX: 048-476-8713
 TEL: 029-270-7891 FAX: 029-270-8510
 TEL: 011-883-0115 FAX: 011-883-0323
 <e-mail> pascal@pascal-co-ltd.co.jp